Облікова картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0205U006476

Державний реєстраційний номер: 0104U010073

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 15-11-2005

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Розвиток комплексу методів практичної діагностики для супроводження сучасних технологій отримання наноструктур із заданими фізичними і фізико-хімічними параметрами та характеристиками

Початок етапу: 10.2004

Закінчення етапу: 12.2005

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 265 40 20

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національний технічний університет "ХПІ"

Код за ЄДРПОУ: 02071180

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон:

Внесок співвиконавця у звітний етап:

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 60, м. Київ, Київська обл., 01033, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 2393141

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією, концерном тощо)

Напрям фінансування:

Джерела фінансування

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Розвиток комплексу методів практичної діагностики для супроводження сучасних технологій отримання наноструктур із заданими фізичними і фізико-хімічними параметрами та характеристиками

Назва роботи англійською:

The complex of methods development for practical diagnostic and support of modern technologies for nanostructures production with specified physical and physico-chemical parameters and characteristics.

Реферат українською:

Проведено теоретичний аналіз особливостей дифракції рентгенівських променів в надграткових напівпровідникових структурах із локальними неоднорідностями типу квантових точок та удосконалена рентгенодифрактометрична методика для її використання в неруйнівній діагностиці компонентного складу напівпровідникових наноструктур.

Реферат англійською:

Theoretical analysis of the X-ray diffraction peculiarities in semiconductor superlattice structures containing quantum dots has been curried out. X-ray technique for nondestructive composition analysis of semiconductor nanostructures was improved.

Індекс УДК: 539.2;538.9-405;548, 535-34

Коди тематичних рубрик: 29.19

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Прокопенко Ігор Васильович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис

5490

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Мачулін Володимир Федорович

Перелік осіб-виконавців

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

